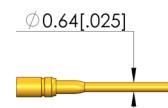
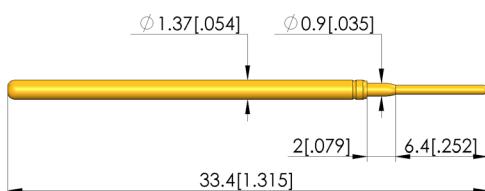




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba probadas por millones para conectar tarjetas PCB
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados.
- Diversas fuerzas del resorte disponibles, así como variantes con resortes de acero inoxidable para altas temperaturas
- Para ajustar las proporciones de carrera óptimas en la fixture pueden realizarse diferentes alturas de montaje a través de la combinación de la punta de prueba con el receptáculo



Datos generales

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	GKS de carrera estándar
Serie:	GKS-100
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-100
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabezal:	0,64 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	8 A
Resistencia (R _i) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	33,4 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,37 mm
Carrera máxima:	6,35 mm
Precarga de muelle:	0,66 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	2 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,3 mm

Test Probe

GKS-100 305 064 A 2000

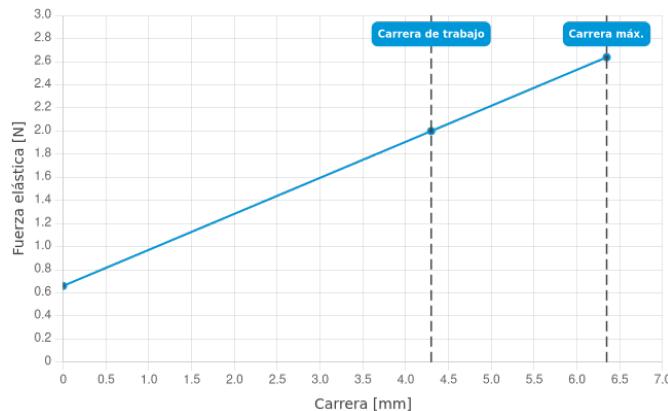
Artículo GKS-100-0087



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA